

ISSN 1561-5405 (print), 2587-9960 (online)  
DOI: 10.24151/1561-5405



## Известия высших учебных заведений. ЭЛЕКТРОНИКА

Том 25, № 1, 2020  
январь – февраль

Научно-технический журнал

Издается с 1996 г.  
Выходит 6 раз в год

**Учредитель и издатель:** *Национальный исследовательский университет «МИЭТ»*

**Главный редактор:** *Чаплыгин Юрий Александрович* – академик РАН, д.т.н., проф., МИЭТ (Москва, Россия), ORCID: 0000-0002-7505-5175

### Редакционная коллегия:

*Гаврилов Сергей Александрович* – заместитель главного редактора, д.т.н., проф., МИЭТ (Москва, Россия), ORCID: 0000-0002-2967-272X

*Бахтин Александр Александрович* – канд.т.н., доц., МИЭТ (Москва, Россия), ORCID: 0000-0002-1107-0878

*Беневоленский Сергей Борисович* – д.т.н., проф., ФГБНУ «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (Москва, Россия), ORCID: 0000-0003-3177-9136

*Быков Дмитрий Васильевич* – д.т.н., проф., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), ORCID: 0000-0002-4935-7292

*Гаврилов Сергей Витальевич* – д.т.н., проф., Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН (Москва, Россия), ORCID: 0000-0003-0566-4482

*Гапоненко Сергей Васильевич* – акад. НАН Беларуси, д.физ.-мат.н., проф., Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (Минск, Беларусь), ORCID: 0000-0003-3774-5471

*Горбачев Александр Алексеевич* – акад. РАН, д.физ.-мат.н., проф., Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва, Россия), ORCID: 0000-0002-1950-356X

*Грибов Борис Георгиевич* – чл.-корр. РАН, д.хим.н., проф., АО «НИИМЭ» (Москва, Россия)

*Коноплев Борис Георгиевич* – д.т.н., проф., Южный федеральный университет (Таганрог, Россия), ORCID: 0000-0003-3105-029X

*Коркишко Юрий Николаевич* – д.физ.-мат.н., проф., НПК «Оптолинк» (Москва, Россия)

*Королёв Михаил Александрович* – д.т.н., проф., МИЭТ (Москва, Россия), ORCID: 0000-0003-3043-1293

*Красников Геннадий Яковлевич* – акад. РАН, д.т.н., проф., АО «НИИМЭ» (Москва, Россия)

*Кубарев Юрий Васильевич* – д.физ.-мат.н., проф., ООО «Центр плазменных и вакуумных технологий» (Москва, Россия)

*Лабунев Владимир Архипович* – акад. НАН Беларуси, иностранный член РАН, д.т.н., проф., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (Минск, Беларусь), ORCID: 0000-0002-3494-4881

*Максимов Иван Александрович* – PhD, проф., Университет города Лунд (Швеция), ORCID: 0000-0003-1944-4878

*Меликян Вазген Шаваршович* – чл.-корр. НАН Армении, д.т.н., проф., ЗАО «Синописис Армения» (Ереван, Армения), ORCID: 0000-0002-1667-6860

*Неволин Владимир Кириллович* – д.физ.-мат.н., проф., МИЭТ (Москва, Россия), ORCID: 0000-0003-4348-0377

© “Известия вузов. Электроника”, 2020  
© МИЭТ, 2020

**Неволин Владимир Николаевич** – д. физ.-мат. н., проф., Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва, Россия)

**Переверзев Алексей Леонидович** – д. т. н., доц., МИЭТ (Москва, Россия),  
ORCID: 0000-0002-5834-5138

**Петросянец Константин Орестович** – д. т. н., проф., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), ORCID: 0000-0001-7969-4786

**Сазонов Андрей Юрьевич** – PhD, проф., Университет Ватерлоо (Канада)

**Сауров Александр Николаевич** – акад. РАН, д. т. н., проф., Институт нанотехнологий микро-электроники РАН (Москва, Россия), ORCID: 0000-0001-7368-5977

**Селищев Сергей Васильевич** – д. физ.-мат. н., проф., МИЭТ (Москва, Россия),  
ORCID: 0000-0002-5589-7068

**Сигов Александр Сергеевич** – акад. РАН, д. физ.-мат. н., проф., МИРЭА – Российский технологический университет (Москва, Россия), ORCID: 0000-0003-2017-9186

**Сидоренко Анатолий Сергеевич** – акад. АН Молдовы, д. физ.-мат. н., проф.,  
Институт электронной инженерии и нанотехнологий АНМ (Кишинев, Молдова),  
ORCID: 0000-0001-7433-4140

**Таиров Юрий Михайлович** – д. т. н., проф., Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург, Россия)

**Телец Виталий Арсеньевич** – д. т. н., проф., Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва, Россия), ORCID: 0000-0003-4944-676X

**Тимошенко Сергей Петрович** – д. т. н., проф., МИЭТ (Москва, Россия),  
ORCID: 0000-0001-5411-1804

**Юриш Сергей Юрьевич** – канд. т. н., IFSA Publishing, S.L. (Барселона, Испания),  
ORCID: 0000-0002-1433-260X

**Заведующая редакцией С.Г. Зверева**

**Редактор А.В. Тихонова**

**Научный редактор С.Г. Зверева**

**Корректор И.В. Проскурякова**

**Верстка А.Ю. Рыжков, С.Ю. Рыжков**

**Адрес редакции:** 124498, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ

**Тел.:** 8-499-734-6205

**E-mail:** magazine@miee.ru

**http://ivuz-e.ru**

**Адрес издателя:** 124498, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ.

**Адрес полиграфического предприятия:** 124498, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ.

Подписано в печать 11.02.2020. Формат бумаги 60×84 1/8. Цифровая печать.

Объем 11,16 усл. печ. л., 11,032 уч.-изд. л. Тираж 180 экз. Заказ № 7. Свободная цена.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-72307 от 01.02.2018.

Включен ВАК в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по следующим группам специальностей:

**05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы**

**05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление**

**05.27.00 Электроника**

Включен в Российский индекс научного цитирования и в Рейтинг Science Index.

Включен в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.

Является членом Cross Ref.

*Плата за публикацию статей не взимается.*

**Подписной индекс в каталоге Агентства «Роспечать» – 47570**

## СОДЕРЖАНИЕ

### Материалы электроники

<i>Браже Р.А., Долгов Д.А.</i> Метод определения упругих характеристик графена и других 2D наноаллотропов .....	7
---	---

### Технологические процессы и маршруты

<i>Белостоцкая С.О., Кузнецов Е.В., Рыбачек Е.Н., Губанова О.В.</i> Латеральная рекристаллизация наноструктур аморфного кремния с использованием силицида никеля .....	19
<i>Новак А.В., Новак В.Р.</i> Исследование процесса электрохимического стоп-травления кремния при изготовлении кантилеверов.....	31

### Элементы интегральной электроники

<i>Исмаил-Заде М.Р.</i> SPICE-модели JFET и MOSFET в широком диапазоне температур.....	40
--	----

### Схемотехника и проектирование

<i>Гаврилов С.В., Железников Д.А., Чочаев Р.Ж.</i> Разработка и сравнительный анализ методов решения задачи размещения для реконфигурируемых систем на кристалле .....	48
--	----

### Биомедицинская электроника

<i>Тельшиев Д.В.</i> Прогнозирование и оценка надежности аппаратов механического замещения функции сердца .....	58
---	----

### Краткие сообщения

<i>Зайнабидинов С., Назиров Д.Э.</i> Влияние термического воздействия на электрофизические свойства кремния, легированного редкоземельными элементами .....	69
<i>Ефимов А.Г., Каменев А.Г., Корнеев С.А., Чистюхин В.В.</i> Принципы проектирования бортовых многолучевых приемных АФАР систем спутниковой связи .....	73
<i>Комаров В.Т.</i> СВЧ-усилитель мощности до 100 Вт на GaN-транзисторах в режиме большого сигнала.....	78
<i>Мьо Мин Тхант, Романюк В.А., Гуминов Н.В.</i> Влияние емкостей НЕМТ-транзистора на основные параметры усилителей СВЧ.....	83

Памяти Таирова Юрия Михайловича.....	89
--------------------------------------	----

### Юбилеи

Саурову Александру Николаевичу – 60 лет .....	91
---	----

### Конференции

Об итогах Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы информатизации в цифровой экономике и научных исследованиях – 2019» .....	92
27-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2020» .....	94
3 <sup>rd</sup> International Conference on Microelectronic Devices and Technologies (MicDAT`2020), 17–19 June 2020, Tenerife (Canary Islands), Spain.....	4-я стр. обложки
К сведению авторов .....	95

ISSN 1561-5405 (print), 2587-9960 (online)  
DOI: 10.24151/1561-5405



**Proceedings of Universities.  
ELECTRONICS**

**Volume 25, No. 1, 2020  
January – February**

*The scientific and technical journal*

*Published since 1996*  
**Published 6 times per year**

**Founder and Publisher:** *National Research University of Electronic Technology*

**Editor-in-Chief:** *Yury A. Chaplygin* – Acad. RAS, Dr. Sci. (Eng.), Prof., MIET (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0002-7505-5175

**Editorial Board:**

*Sergey A. Gavrillov* – Deputy Editor-in-Chief, Dr. Sci. (Eng.), Prof., MIET (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0002-2967-272X

*Aleksandr A. Bakhtin* – Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., MIET (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0002-1107-0878

*Sergey B. Benevolensky* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., Scientific Research Institute – Federal Research Centre for Projects Evaluation and Consulting Services (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0003-3177-9136

*Dmitri V. Bykov* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0002-4935-7292

*Sergey V. Gavrillov* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., Institute for Design Problems in Microelectronics of RAS (Moscow, Russian), ORCID: 0000-0003-0566-4482

*Sergey V. Gaponenko* – Acad. NAS of Belarus, Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research (Minsk, Belarus), ORCID: 0000-0003-3774-5471

*Aleksandr A. Gorbatshevich* – Acad. RAS, Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., P.N. Lebedev Physical Institute of the RAS (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0002-1950-356X

*Boris G. Gribov* – Cor. Mem. RAS, Dr. Sci. (Chem.), Prof., JSC «NIIME» (Moscow, Russia)

*Boris G. Konoplev* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., Southern Federal University (Taganrog, Russia), ORCID: 0000-0003-3105-029X

*Yury N. Korkishko* – Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., SMS «Optolink» (Moscow, Russia)

*Mikhail A. Korolev* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., MIET (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0003-3043-1293

*Gennady Y. Krasnikov* – Acad. RAS, Dr. Sci. (Eng.), Prof., JSC «NIIME» (Moscow, Russia)

*Yuri V. Kubarev* – Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., LLC «Center for Plasma and Vacuum Technologies» (Moscow, Russia)

*Vladimir A. Labunov* – Acad. NAS of Belarus, Foreign member of RAS, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Minsk, Belarus), ORCID: 0000-0002-3494-4881

*Ivan A. Maksimov* – PhD, Prof., Lund University (Sweden), ORCID: 0000-0003-1944-4878

*Vazgen S. Melikyan* – Cor. Mem. NAS of Armenia, Dr. Sci. (Eng.), Prof., CJS Company «Synopsis, Armenia» (Yerevan, Armenia), ORCID: 0000-0002-1667-6860

*Vladimir K. Nevolin* – Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., MIET (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0003-4348-0377

© “Proceedings of Universities. Electronics”, 2020  
© MIET, 2020

*Vladimir N. Nevolin* – Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., P.N. Lebedev Physical Institute of the RAS (Moscow, Russia)

*Aleksey L. Pereverzev* – Dr. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., MIET (Moscow, Russia),  
ORCID: 0000-0002-5834-5138

*Konstantin O. Petrosyantz* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0001-7969-4786

*Aleksandr N. Saurov* – Acad. RAS, Dr. Sci. (Eng.), Prof., Institute of Nanotechnology of Microelectronics of the RAS (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0001-7368-5977

*Andrey Y. Sazonov* - PhD, Prof., University of Waterloo (Canada)

*Sergey V. Selishchev* – Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., MIET (Moscow, Russia),  
ORCID: 0000-0002-5589-7068

*Anatolie S. Sidorenko* – Acad. AS of Moldova, Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies ASM (Chisinau, Moldova),  
ORCID: 0000-0001-7433-4140

*Aleksandr S. Sigov* – Acad. RAS, Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., MIREA – Russian Technological University (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0003-2017-9186

*Yury M. Tairov* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., Saint-Petersburg Electrotechnical University (LETI) (St. Petersburg, Russia)

*Vitaly A. Telets* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., National Research Nuclear University MEPhI (Moscow, Russia), ORCID: 0000-0003-4944-676X

*Sergey P. Timoshenkov* – Dr. Sci. (Eng.), Prof., MIET (Moscow, Russia),  
ORCID: 0000-0001-5411-1804

*Sergey Yu. Yurish* – Cand. Sci. (Eng.), IFSA Publishing, S.L. (Barcelona, Spain),  
ORCID: 0000-0002-1433-260X

**Head of editorial staff** *Zvereva S.G.*

**Chief editors** *Tikhonova A.V., Proskuryakova I.V.*

**Make-up** *Ryzhkov S.Yu., Ryzhkov A.Yu.*

**Editorial Board's address:** 124498, Russia, Moscow, Zelenograd, Bld. 1, Shokin Square, MIET, editorial office of the Journal «Proceedings of Universities. Electronics»

**Tel.:** +7-499-734-62-05

**E-mail:** magazine@miee.ru

**http://ivuz-e.ru**

**Publisher's address:** 124498, Russia, Moscow, Zelenograd, Bld. 1, Shokin Square, MIET

**Printery address:** 124498, Russia, Moscow, Zelenograd, Bld. 1, Shokin Square, MIET

Signed to print 11.02.2020. Sheet size 60×84 1/8. Digital printing. Conventional printed sheets 11,16. Number of copies 180. Order no. 7. Free price.

The media registration certificate ПИ № ФС 77-72307 of 01.02.2018.

The journal is included into the List of reviewed scientific publications, in which the main scientific results of thesis for candidate of science and doctor degrees must be published for the following groups of specialties:

**05.11.00 Instrumentation, metrology and information-measuring devices and systems**

**05.13.00 Computer science, computer engineering and management**

**05.27.00 Electronics**

The journal is included into the Russian index of scientific citing and into the Rating Science Index.

The journal is included into the Russian Science Citation Index on the Web of Science basis.

Is the member of Cross Ref.

*The fee for the publication of articles is not charged.*

**The subscription index in catalogue of Agency Rospechat – 47570**

## CONTENTS

### Electronics materials

<i>Brazhe R.A., Dolgov D.A.</i> Method of Finding Elastic Characteristics of Graphene and Other 2D Nanoallotropes.....	7
--	---

### Technological processors and routes

<i>Belostotskaya S.O., Kuznetsov E.V., Rybachek E.N., Gubanova O.V.</i> Lateral Crystallization of Amorphous Silicon Nanowires Using NickelSilicide .....	19
<i>Novak A.V., Novak V.R.</i> Investigation of Electrochemical Stop-Etching Process of Silicon at Cantilevers Fabrication .....	31

### Integrated electronics elements

<i>Ismail-Zade M.R.</i> JFET and MOSFET Spice Models in Wide Temperature Range.....	40
---	----

### Engineering and design

<i>Gavrilov S.V., Zheleznikov D.A., Chochoev R.Z.</i> Development and Comparative Analysis of Placement Methods for Reconfigurable Systems-on-a-Chip .....	48
--	----

### Biomedical electronics

<i>Telyshev D.V.</i> Mechanical Circulatory Support Systems Reliability Prediction and Assessment .....	58
---	----

### Brief reports

<i>Zaynabidinov S., Nazirov D.E.</i> The Effect of Thermal Treatments on the Electrophysical Properties of Silicon Doped by Rare-Earth Elements.....	69
<i>Efimov A.G., Kamenev A.G., Korneev S.A., Chistyukhin V.V.</i> Multi-Beam Receiving APAA Space Communication Systems .....	73
<i>Komarov V.T.</i> Amplifier of Power up to 100 Wt Based on GAN Transistors in Large Signal Mode ....	78
<i>Myo Min Thant, Romanyuk V.A., Guminov N.V.</i> Effect of HEMPT Capacitances on Microwave Amplifier Main Parameters .....	83

In memory of Tairov Yury Mikhailovich.....	89
--	----

### Anniversaries

Saurov Aleksandr Nikolaevich is 60 years old.....	91
---	----

### Conferences

Results of the International Scientific and Practical Conference «Actual Problems of Informatization in the Digital Economy and Research – 2019» .....	92
27th All-Russian Interuniversity Scientific and Technical Conference of Students and Graduate Students «Microelectronics and Informatics – 2020».....	94
3 <sup>rd</sup> International Conference on Microelectronic Devices and Technologies (MicDAT`2020), 17–19 June 2020, Tenerife (Canary Islands), Spain.....	4 cover page
Instructions for authors .....	95